

**MODELO DE PLANO DE ENSINO
FICHA Nº 2 (variável)**

Disciplina: Interferência Eletromagnética		Código: TE257
Natureza: (X) obrigatória () optativa	Semestral (X) Anual () Modular ()	
Pré-requisito: Não há	Co-requisito: Não há	
Modalidade: (X) Presencial () EaD () 20% EaD		
C.H. Semestral Total: 60h C.H. Anual Total: C.H. Modular Total: PD: 30 LB: 30 CP: 00 ES: 00 OR: 00 C.H. Semanal: 04h		
EMENTA (Unidades Didáticas)		
Fontes de interferência eletromagnética. Mecanismos de interferência eletromagnética. Bloqueio de interferência eletromagnética. Normas Técnicas. Modelagem Computacional		
PROGRAMA (itens de cada unidade didática)		
1. INTRODUÇÃO À COMPATIBILIDADE ELETROMAGNÉTICA 1.1. Aspectos de EMC, 1.2. Histórico 1.3. Dimensões Elétricas 1.4. Decibéis e unidades comuns de EMC 2. REQUISITOS DE EMC PARA SISTEMAS ELETRÔNICOS 3. LINHAS DE TRANSMISSÃO E INTEGRIDADE DO SINAL 4. TIPOS E CARACTERÍSTICAS DE ANTENAS 5. COMPORTAMENTO NÃO IDEAL DE COMPONENTES 6. EMISSÃO IRRADIADA E CONDUZIDA 7. SUSCEPTIBILIDADE 8. EFEITO DIAFÔNICO 9. BLINDAGEM ELETROMAGNÉTICA 10. DESCARGAS ELETROSTÁTICAS		
OBJETIVO GERAL		
O aluno deverá ser capaz de compreender as causas e os efeitos das interferências de origem eletromagnética, bem como a importância da sua consideração no projeto de sistemas eletrônicos embarcados.		
OBJETIVO ESPECÍFICO		
Ensinar conceitos na área de compatibilidade eletromagnética.		
PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS		
Aulas teóricas expositivas e resolução de exercícios em sala de aula. Serão utilizados os seguintes recursos: quadro branco, computador e projetor multimídia.		

PLANO DE ENSINO

FICHA Nº 2 (variável)

FORMAS DE AVALIAÇÃO

Os alunos serão avaliados através de duas provas escritas e atividades de laboratório. A nota final será por:

$$MF = 0,7(A1+A2)/2 + 0,3L$$

onde: MF é a média final; A1 e A2 são as avaliações escritas e tem peso de 70% na média final; L é a média obtida nas atividades de laboratório.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA (3 títulos)

- Paul, C. R. Introduction to Electromagnetic Compatibility. 2. ed. New York, John Wiley & Sons, 2006.
- Williams, T. EMC for Product Designers. 4. ed. Oxford, Elsevier, 2007.
- Tesche, F. M. Ianoz, M. V. Karlsson, T. EMC Analysis Methods and Computational Models. New York, John Wiley & Sons, 1996.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (2 títulos)

- Ott, H. W. Noise Reduction Techniques in Electronic Systems. 2. ed, New York, John Wiley & Sons, 1988
- Poljak, D. Advanced Modeling in Computational Electromagnetic Compatibility. New York, John Wiley & Sons, 2007.

Professor da Disciplina: Marcos Vinicio Haas Rambo

Assinatura: _____

Chefe de Departamento: Prof. Eduardo Parente Ribeiro

Assinatura: _____

Legenda:

Conforme Resolução 15/10-CEPE: PD- Padrão LB – Laboratório CP – Campo ES – Estágio OR - Orientada